

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0181 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	株式会社村田製作所 横浜事業所
法人の名称	株式会社村田製作所 法人番号 4130001030475
問い合わせ窓口	品質保証統括部 信頼性技術センタ 信頼性技術 4 課 TEL : 045-939-7147



20250711評基第009号  
2026年2月12日

# 認定証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認定識別: JCSS 0181 Calibration

適合性評価機関の名称: 株式会社村田製作所 横浜事業所

法人の名称: 株式会社村田製作所

適合性評価機関の所在地: 神奈川県横浜市緑区白山1丁目18番1号

認定範囲: 時間・周波数及び回転速度、温度、  
電気（直流・低周波）（詳細は別紙のとおり）

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書（JCSS 認定）に記載した  
認定要求事項

認定発効日: 2023年12月4日

認定の有効期限: 2027年12月3日

初回認定発効日: 2006年9月6日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 石毛 浩美

- ・相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準（該当する国際規格）適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項（方針）を指します。
- ・この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです（2017年4月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照）。
- ・IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録（認定）に係る区分：時間・周波数及び回転速度

法律に基づく初回登録年月日：2011年2月15日

国際MRA対応初回認定発効日：2011年2月15日

校正手法の区分の呼称〔登録又は登録更新（認定発効）年月日〕：時間・周波数測定器等〔2023年12月4日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約95%)
時間・周波数測定器等	周波数標準器	10 MHz	$1.8 \times 10^{-5}$ Hz
	周波数発生器	10 Hz 以上 100 Hz 未満	$3.0 \times 10^{-4}$ Hz
		100 Hz 以上 1 kHz 未満	$1.0 \times 10^{-4}$ Hz
		1 kHz 以上 10 kHz 未満	$3.0 \times 10^{-5}$ Hz
		10 kHz 以上 100 kHz 未満	$1.0 \times 10^{-5}$ Hz
		100 kHz 以上 1 MHz 未満	$1.0 \times 10^{-5}$ Hz
		1 MHz 以上 10 MHz 未満	$1.5 \times 10^{-4}$ Hz
		10 MHz 以上 100 MHz 未満	$1.0 \times 10^{-3}$ Hz
		100 MHz 以上 1 GHz 未満	1.0 Hz
		1 GHz 以上 10 GHz 未満	1.0 Hz
		10 GHz 以上 40 GHz 以下	4.0 Hz
	周波数測定器	10 Hz 以上 100 Hz 未満	$3.0 \times 10^{-4}$ Hz
		100 Hz 以上 1 kHz 未満	$1.0 \times 10^{-4}$ Hz
		1 kHz 以上 10 kHz 未満	$3.0 \times 10^{-5}$ Hz
		10 kHz 以上 100 kHz 未満	$1.0 \times 10^{-5}$ Hz
		100 kHz 以上 1 MHz 未満	$1.0 \times 10^{-5}$ Hz
		1 MHz 以上 10 MHz 未満	$1.5 \times 10^{-4}$ Hz
		10 MHz 以上 100 MHz 未満	$1.0 \times 10^{-3}$ Hz
		100 MHz 以上 1 GHz 未満	1.0 Hz
		1 GHz 以上 10 GHz 未満	1.0 Hz
10 GHz 以上 40 GHz 以下		4.0 Hz	
時間間隔測定器	1 s 以上 3600 s 以下	0.10 s	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

注) 周波数標準器、周波数発生器、周波数測定器の拡張不確かさは、被校正器物に係る不確かさ要因を含んでいません。

時間間隔測定器の拡張不確かさは、被校正器物に係る不確かさ要因を含んでいます。

登録（認定）に係る区分：時間・周波数及び回転速度

法律に基づく初回登録年月日：2011年2月15日

国際MRA対応初回認定発効日：2011年2月15日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：時間・周波数測定器等〔2023年12月4日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設以外で行う校正（遠隔校正）

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	サービス領域 (基線長)	拡張不確かさ (信頼の水準約95%)
時間・周波数測定器等	周波数標準器	10 MHz	50 km 以下	$4.2 \times 10^{-6}$ Hz
			50 km 超 500 km 以下	$4.3 \times 10^{-6}$ Hz
			500 km 超 1600 km 以下	$7.4 \times 10^{-6}$ Hz

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

注) 周波数標準器の拡張不確かさは、被校正器物に係る不確かさ要因を含んでいません。

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2014年3月20日

国際MRA対応初回認定発効日：2014年3月20日

校正手法の区分の呼称 [登録又は登録更新（認定発効）年月日]：直流・低周波測定器等 [2023年12月4日]

(\*) [2026年2月12日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	直流抵抗器	1 mΩ	3.3 μΩ/Ω
		10 mΩ	2.5 μΩ/Ω
		100 mΩ	1.8 μΩ/Ω
		1 Ω	1.4 μΩ/Ω
		10 Ω	0.83 μΩ/Ω
		100 Ω	0.20 μΩ/Ω
		1 kΩ	0.49 μΩ/Ω
		10 kΩ	1.3 μΩ/Ω
		100 kΩ	1.4 μΩ/Ω
		1 MΩ	1.9 μΩ/Ω
		1 MΩ 超 10 MΩ 未満	0.040 %
		10 MΩ	2.7 μΩ/Ω
		10 MΩ 超 100 MΩ 未満	0.090 %
		100 MΩ	14 μΩ/Ω
		100 MΩ 超 1 GΩ 未満	0.20 %
		1 GΩ	36 μΩ/Ω
		1 GΩ 超 10 GΩ 未満	0.20 %
		10 GΩ	57 μΩ/Ω
		100 GΩ	0.013 %
		1 TΩ	0.027 %
	10 TΩ	0.069 %	
	直流抵抗測定装置	1 mΩ	0.064 %
		10 mΩ	64 μΩ/Ω
		100 mΩ	8.2 μΩ/Ω
		1 Ω	1.6 μΩ/Ω
		10 Ω	1.6 μΩ/Ω
		100 Ω	0.78 μΩ/Ω
		1 kΩ	1.3 μΩ/Ω
10 kΩ		1.4 μΩ/Ω	
100 kΩ	1.8 μΩ/Ω		
1 MΩ	2.3 μΩ/Ω		
10 MΩ	3.7 μΩ/Ω		
100 MΩ	0.019 %		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	直流電圧発生装置	-1000 V 以上 -1 V 未満 (*)	3.0 $\mu\text{V}/\text{V}$
		-1 V 以上 -100 mV 未満 (*)	4.0 $\mu\text{V}/\text{V}$
		-100 mV 以上 -10 mV 未満 (*)	7.0 $\mu\text{V}/\text{V}$
		-10 mV	60 $\mu\text{V}/\text{V}$ (*)
		10 mV	60 $\mu\text{V}/\text{V}$ (*)
		10 mV 超 100 mV 以下 (*)	7.0 $\mu\text{V}/\text{V}$
		100 mV 超 1 V 以下 (*)	4.0 $\mu\text{V}/\text{V}$
		1 V 超 1000 V 以下 (*)	3.0 $\mu\text{V}/\text{V}$
	直流電流測定装置	-100 $\mu\text{A}$	0.024 %
		-20 $\mu\text{A}$	0.024 %
		-2 $\mu\text{A}$	0.024 %
		-200 nA	0.025 %
		-20 nA	0.007 8 % (*)
		-2 nA	0.009 3 % (*)
		-200 pA	0.065 % (*)
		-20 pA	0.072 % (*)
		-2 pA	0.31 % (*)
		2 pA	0.31 % (*)
		20 pA	0.072 % (*)
		200 pA	0.065 % (*)
		2 nA	0.009 3 % (*)
		20 nA	0.007 8 % (*)
		200 nA	0.025 %
		2 $\mu\text{A}$	0.024 %
		20 $\mu\text{A}$	0.024 %
100 $\mu\text{A}$	0.024 %		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2006年9月6日

国際MRA対応初回認定発効日：2006年9月6日

校正手法の区分の呼称〔登録又は登録更新（認定発効）年月日〕：低周波インピーダンス測定器等〔2023年12月4日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
低周波 インピーダンス測定器等	キャパシタ	1 kHz	1 pF	静電容量 損失係数	11 $\mu$ F/F 0.000 081
			10 pF	静電容量 損失係数	5.5 $\mu$ F/F 0.000 042
			100 pF	静電容量 損失係数	1.7 $\mu$ F/F 0.000 013
			1 nF	静電容量 損失係数	7.2 $\mu$ F/F 0.000 045
			10 nF	静電容量 損失係数	61 $\mu$ F/F 0.000 15
			100 nF	静電容量 損失係数	76 $\mu$ F/F 0.000 50
			1 $\mu$ F	静電容量 損失係数	89 $\mu$ F/F 0.000 78
			10 $\mu$ F	静電容量 損失係数	0.010 % 0.001 2
			100 $\mu$ F	静電容量 損失係数	0.012 % 0.001 5
		1 MHz	1 pF	静電容量 損失係数	0.011 % 0.000 04
			10 pF	静電容量 損失係数	56 $\mu$ F/F 0.000 03
			100 pF	静電容量 損失係数	58 $\mu$ F/F 0.000 05
			1 nF	静電容量 損失係数	78 $\mu$ F/F 0.000 05

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
低周波 インピーダンス測定器等	キャパシタンス 測定装置	1 kHz	1 pF	静電容量 損失係数	11 $\mu$ F/F 0.000 081
			10 pF	静電容量 損失係数	5.4 $\mu$ F/F 0.000 042
			100 pF	静電容量 損失係数	1.7 $\mu$ F/F 0.000 013
			1 nF	静電容量 損失係数	24 $\mu$ F/F 0.000 045
			10 nF	静電容量 損失係数	78 $\mu$ F/F 0.000 48
			100 nF	静電容量 損失係数	90 $\mu$ F/F 0.000 76
			1 $\mu$ F	静電容量 損失係数	0.010 % 0.001 1
			10 $\mu$ F	静電容量 損失係数	0.011 % 0.001 3
			100 $\mu$ F	静電容量 損失係数	0.013 % 0.001 5
	インダクタ	1 kHz	100 $\mu$ H	0.05 %	
			1 mH	0.03 %	
			10 mH	0.017 %	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：温度

法律に基づく初回登録年月日：2021年10月25日

国際MRA対応初回認定発効日：2021年10月25日

校正手法の区分の呼称〔登録又は登録更新（認定発効）年月日〕：接触式温度計〔2023年12月4日〕（\*）〔2026年2月12日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
接触式温度計	定点実現装置	水銀点	4.1 mK	
		水の三重点	2.1 mK	
		ガリウム点	3.9 mK	
		インジウム点	5.2 mK	
		スズ点	6.5 mK	
		亜鉛点 (*)	6.5 mK	
	抵抗温度計 (定点校正法)	標準白金 抵抗温度計 (25 Ω)	水銀点	5.2 mK (*1)
			水の三重点	2.5 mK (*1)
			ガリウム点	4.1 mK (*1)
			インジウム点	5.6 mK (*1)
			スズ点	7.2 mK (*1)
			亜鉛点 (*)	7.9 mK (*1)
		標準白金 抵抗温度計 (100 Ω)	水銀点	4.2 mK (*1)
			水の三重点	2.7 mK (*1)
			ガリウム点	4.3 mK (*1)
			インジウム点	5.8 mK (*1)
		スズ点	7.0 mK (*1)	
		亜鉛点 (*)	8.1 mK (*1)	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

(\*1)：抵抗値( $R(T_{90})$ )の温度換算値